

**ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ $Hg_{1-x}Mn_xTe$,
СВЯЗАННАЯ С ЛОКАЛЬНЫМ УРОВНЕМ Mn^+**

Георгицэ Е. И., Иванов-Омский В. И., Мастеров В. Ф.,
Погорлецкий В. М., Пиотровский Т., Смирнов В. А.

Приведены результаты исследования фотолюминесценции твердых растворов $Hg_{1-x}Mn_xTe$ ($0.19 \leq x \leq 0.30$) в интервале температур $2 \div 200$ К. Показано, что в сплавах, обогащенных марганцем, наблюдаются оптические переходы между состояниями, жестко связанными с валентной зоной, к которым наряду с мелкими акцепторами относятся антисвязывающие состояния с недостроенной d -оболочкой Mn^+ ($3d^6$) в запрещенной зоне на уровне мелкого акцептора, приписываемого обычно собственным дефектам. Предложена энергетическая модель, с помощью которой объясняются наблюдаемые особенности. В соответствии с предложенной моделью в разбавленных полумагнитных сплавах $Hg_{1-x}Mn_xTe$ ($x < 0.20$) уровень, связанный с марганцем Mn^+ , находится в зоне проводимости и в излучательных процессах не проявляется, а при $x > 0.20$ этот уровень выходит в запрещенную зону и принимает участие в рекомбинационных процессах. Вырождение уровня Mn^+ с зоной проводимости снижается для состава $x = 0.224$. Глубина залегания уровня $3d^6$ в валентной зоне оценивается величиной ~ 4.9 эВ.

В твердых растворах $Hg_{1-x}Mn_xTe$ при увеличении содержания марганца (x) зонная структура плавно перестраивается от бесщелевой инверсной, для которой $\epsilon_g < 0$, до обычной структуры с $\epsilon_g > 0$ [1]. Фотолюминесцентные свойства разбавленных твердых растворов $Hg_{1-x}Mn_xTe$ ($x \leq 0.15$) при низких температурах исследовались в работах [1, 2]. Наблюдаемая для этих сплавов примесная линия в спектрах фотолюминесценции при 4.2 К в отсутствие магнитного поля авторами [2] приписывается собственным дефектам.

В настоящей работе приведены результаты исследования фотолюминесценции твердых растворов $Hg_{1-x}Mn_xTe$, более обогащенных марганцем ($0.19 \leq x \leq 0.3$), в интервале температур $2 \div 200$ К. Образцы получены методом Бриджмена, концентрация носителей при 77 К изменялась в пределах $2 \cdot 10^{15} \div 1 \times 10^{16}$ см $^{-3}$. Состав и степень однородности определены рентгеноспектральным анализом. Перед измерениями образцы подвергались механической полировке с последующим травлением в полирующим травителе. Возбуждение фотолюминесценции осуществлялось с помощью твердотельного лазера Nd : YAG, мощность которого при работе в одномодовом режиме достигала 0.5 Вт. Излучение модулировалось с частотой ~ 700 Гц.

На рис. 1 представлены типичные спектры фотолюминесценции для сплава $p\text{-}Hg_{0.77}Mn_{0.23}Te$ в отсутствие магнитного поля при различных температурах в интервале $2 \div 168$ К. Из представленных результатов видно, что спектры ФЛ в исследуемом интервале температур имеют двухполосную структуру. Энергетическое расстояние между максимумами наблюдаемых полос при температурах $2 \div 12$ К составляло $18 \div 20$ МэВ. Низкоэнергетическая полоса при низких температурах более интенсивная, чем высокоэнергетическая. Отношение их интенсивностей при 2 К составляет 10^3 . С повышением температуры низкоэнергетическая полоса ФЛ гаснет и практически исчезает при 60 К, а интенсивность высокоэнергетической полосы растет, и уже при температуре 60 К эта полоса становится преобладающей. Можно предположить, что высокоэнергетическая полоса связана с межзонными переходами. Об этом, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что она смешается в коротковолновую область.

спектра с наклоном, соответствующим температурному коэффициенту изменения ширины запрещенной зоны, который в этом сплаве принимает значение $\sim 2 \cdot 10^{-4}$ эВ/К. Полученное значение для температурного коэффициента изменения ширины запрещенной зоны согласуется с литературными данными для растворов $Hg_{1-x}Mn_xTe$ [3]. По положению высокоэнергетической полосы ФЛ определена ширина запрещенной зоны, которая оказалась при $T=168$ К равной 0.554 эВ и согласуется с известными зависимостями ширины запрещенной зоны от состава и температуры [3]. Анализ формы линии высокоэнергетической полосы также подтверждает сделанное предположение о ее связи с межзонными переходами. Согласно методике, приведенной в работе [4], рассчитана форма

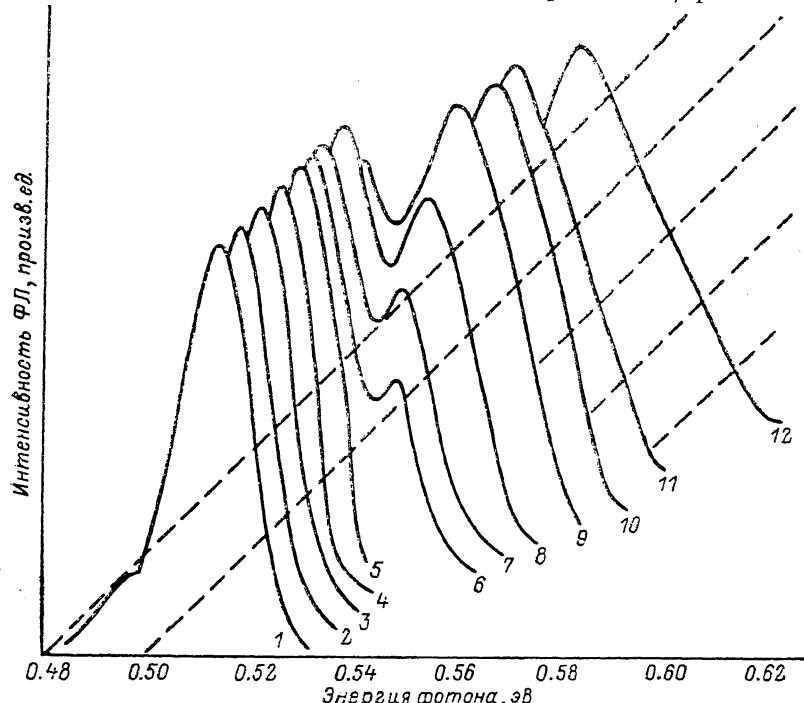


Рис. 1. Спектры излучательной рекомбинации сплава p - $Hg_{1-x}Mn_xTe$ при разных температурах.

$T, K: 1 - 2, 2 - 4.8, 3 - 13, 4 - 20, 5 - 35, 6 - 40, 7 - 43, 8 - 48, 9 - 53, 10 - 89, 11 - 94, 12 - 150.$

линий ФЛ для межзональных переходов. Подгоночным параметром служила величина квазиуровня Ферми, который определялся из сравнения экспериментальной и расчетной спектральных кривых ФЛ в высокоэнергетической области спектра. На рис. 2 представлены результаты этого сравнения для ряда температур. Видно, что расчет хорошо описывает высокоэнергетическую часть полосы ФЛ. Наиболее сильное расхождение теории и эксперимента по полуширине линий ФЛ наблюдается для температуры жидкого азота 77 К. Видимо, это связано с вкладом низкоэнергетической полосы фотолюминесценции. Полученное значение для квазиуровня Ферми при температуре 168 К (наилучшее совпадение теории и эксперимента) $Le/kT \approx 1.3$ соответствует концентрации неравновесных носителей $\sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Для остальных параметров в расчете использовались при этой температуре значения $\epsilon_g = 0.554$ эВ, эффективная масса электронов $m_e^* = 0.039 m_0$, эффективная масса тяжелых дырок $m_h^* = 0.4 m_0$, где m_0 — масса свободного электрона.

На рис. 3, а представлены температурные зависимости энергетических положений максимумов наблюдаемых полос для сплава $Hg_{0.81}Mn_{0.19}Te$. Видно, что для этого сплава низкоэнергетическая полоса фотолюминесценции с температурой смещается, отслеживая температурный ход ширины запрещенной зоны. Этот результат согласуется с литературными данными [3, 5]. В этом случае излучательная рекомбинация связана с обычным для этого материала пере-

ходом зоны проводимости — акцептор. Схема наблюдаемых оптических переходов для исследуемого сплава $Hg_{0.81}Mn_{0.19}Te$ приведена на рис. 4.

На рис. 3, б представлены температурные зависимости энергетических положений наблюдаемых полос фотолюминесценции для сплава $Hg_{0.77}Mn_{0.23}Te$. Видно, что увеличение содержания марганца в сплаве резко изменяет температурную зависимость низкоэнергетической полосы фотолюминесценции.

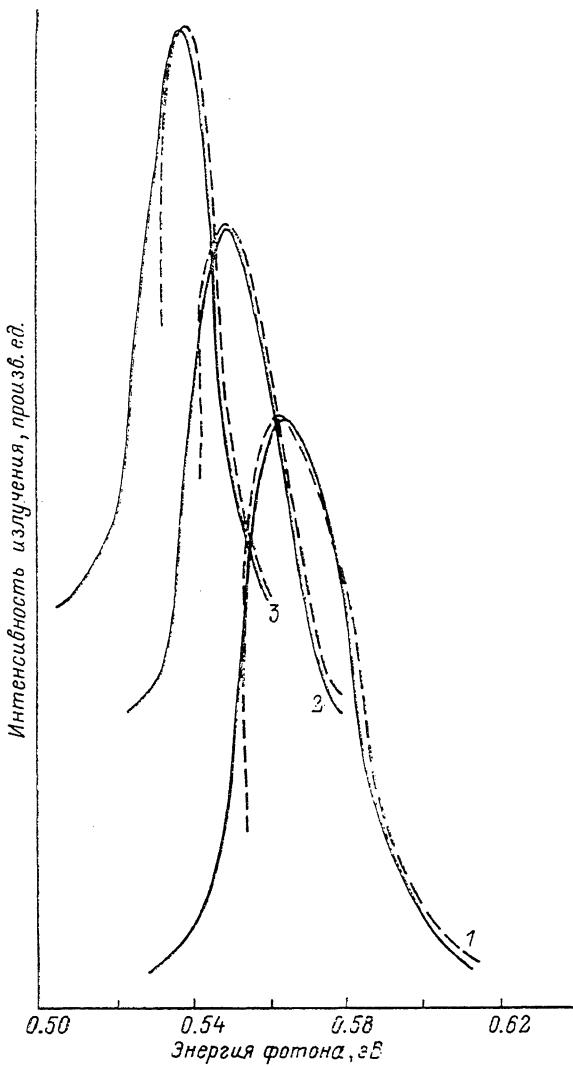


Рис. 2. Спектры излучательной рекомбинации сплава $Hg_{0.77}Mn_{0.23}Te$.

Сплошные линии — эксперимент, штриховые — теоретический расчет в соответствии с методикой [4]. Т, К: 1 — 168, 2 — 150, 3 — 177.

Низкоэнергетическая полоса ФЛ практически не смещается во всем исследуемом интервале температур. Это обстоятельство позволяет считать, что в данном случае наблюдаются оптические переходы между состояниями, жестко связанными с валентной зоной, к которым параллельно с мелкими акцепторами, по-видимому, относятся состояния с недостроенной 3d-оболочкой марганца (Mn^{+}).

Введение переходных элементов в полупроводник при изовалентном замещении приводит к образованию двух типов уровней, связанных с d-состояниями марганца [6]. Одна пара уровней симметрии e и t_2 оказывается глубоко в валентной зоне и носит характер своеобразных «резонансов», т. е. электроны этих уровней в значительной степени локализованы на самом атоме. На рис. 4 эти

состояния схематически представлены в виде уровня $3d^6$. Другой тип уровней, соответствующий антисвязывающему состоянию, лежит на несколько электрон-вольт выше и может оказаться в запрещенной зоне или в зоне проводимости. При этом $-e^-$ и $-t_2$ -состояния оказываются в значительной степени делокализованными. Вообще говоря, антисвязывающие состояния могут проявляться либо в процессах рассеяния (уровни в зоне проводимости), либо в оптических

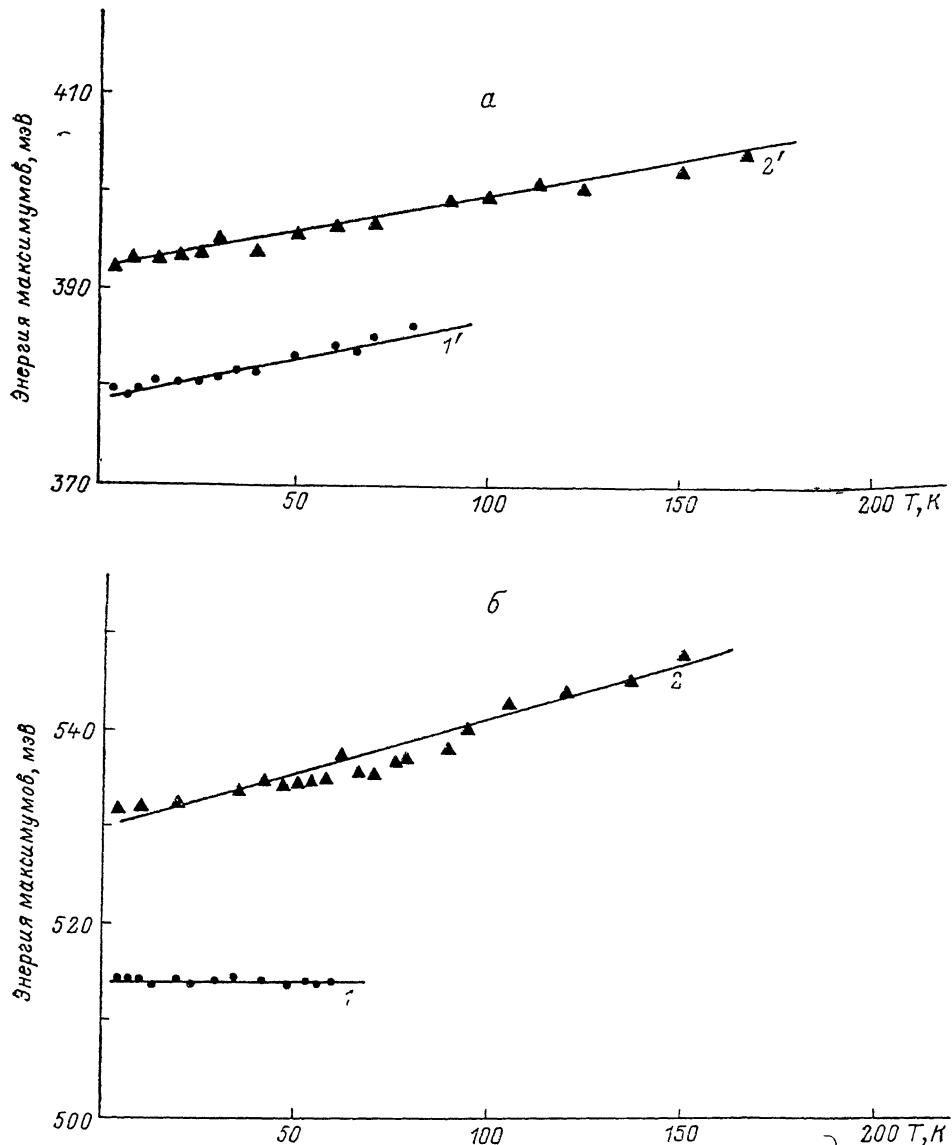


Рис. 3. Температурное смещение излучательных переходов зона—зона (переходы 2, 2'), зона—акцептор (переходы 1, 1') для сплавов Hg_{0.81}Mn_{0.19}Te (а) и Hg_{0.77}Mn_{0.23}Te (б).

переходах (уровни в запрещенной зоне). Как было показано в работах [6, 8], оба типа уровней жестко связаны между собой и с валентной зоной полупроводника. Расстояние между уровнями марганца $3d^5$ и $3d^6$, согласно [7, 8], оценивается в пределах 5.8 ± 7 эВ. В силу этих особенностей уровня (Mn^{+}) его энергетическое расстояние от валентной зоны от температуры не зависит, то же самое относится и к его расстоянию от акцепторного уровня. Схема соответствующих оптических переходов в случае, когда уровень Mn^{+} оказывается в запрещенной зоне, показана на рис. 4.

Из предложенной модели следует, что для разбавленных сплавов $Hg_{1-x}Mn_xTe$ ($x < 0.2$) уровень, связанный с марганцем (Mn^+), находится в зоне проводимости и в излучательных процессах не проявляется, а при $x > 0.2$ выходит в запрещенную зону. Следует иметь в виду относительность понятия уровня, так как при рассматриваемых концентрациях марганца должно произойти его размытие в зону, достаточно узкую из-за сильной локальности d -состояний по сравнению с p -состояниями. При возбуждении ФЛ неравновесные электроны могут локализоваться на уровне Mn^+ с последующей излучательной рекомбинацией на мелкий акцепторный уровень. При низких температурах в излучении преобладают именно такие переходы. При увеличении температуры интенсивность излучательного перехода зона—зона (на схеме переход 2) возрастает.

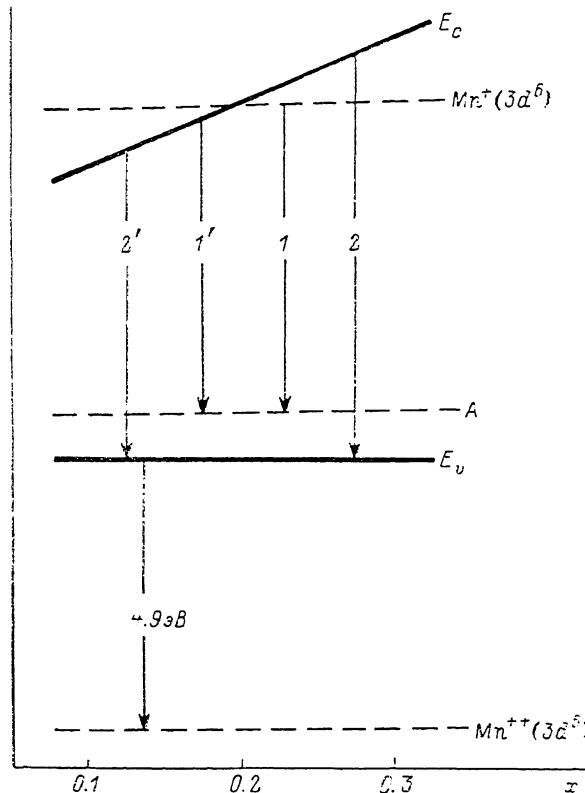


Рис. 4. Диаграмма излучательных переходов для сплавов $Hg_{0.81}Mn_{0.19}Te$ (переходы 1', 2') и $Hg_{0.77}Mn_{0.23}Te$ (переходы 1, 2).

Это связано с тем, что при увеличении температуры происходит делокализация электронов с уровня Mn^+ в зону проводимости, или с понижацией акцепторов, если имеет место переход типа I на рис. 4.

На рис. 5 представлена зависимость интенсивности примесной полосы фотолюминесценции от уровня возбуждения для двух составов. Для состава $x=0.19$, в котором уровень Mn^+ еще вырожден с зоной проводимости, указанная зависимость линейна, что можно ожидать для переходов зона проводимости—акцептор при не слишком высоком уровне возбуждения. Для состава $x=0.23$, в котором снято вырождение уровня Mn^+ с зоной проводимости, наблюдается тенденция к насыщению. Можно связать это с межпримесным характером рекомбинации, т. е. считать, что наблюдаемая нелинейность служит достаточным аргументом в пользу модели с переходом типа I на рис. 4.

На рис. 6 изображена зависимость интенсивности примесной полосы ФЛ от температуры, наклон которой соответствует энергии ~ 0.012 эВ и близок к величине возможной глубины залегания мелких акцепторов в исследованных

материалах [2]. Таким образом, существуют по крайней мере три аргумента в пользу модели с переходами типа I на рис. 4.

Линейная интерполяция экспериментальных данных па рис. 4 позволяет оценить содержание марганца, при котором снимается вырождение с уровней

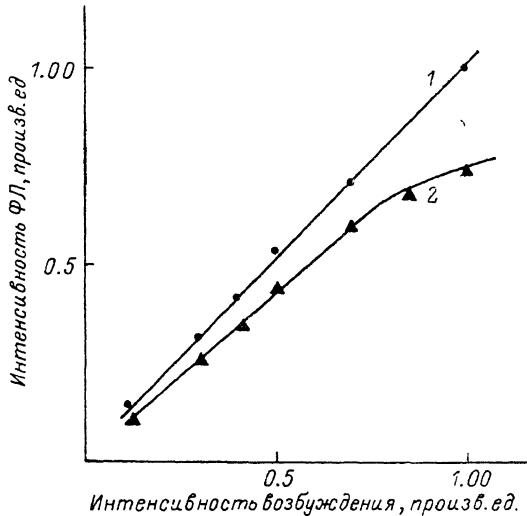


Рис. 5. Зависимость интенсивности ФЛ от уровня возбуждения для составов $x=0.19$ (1) и 0.23 (2) при температуре 4.2 К в отсутствие магнитного поля.

Mn^+ с зоной проводимости. Нетрудно убедиться в том, что это происходит при $x=0.224$. При этом составе расплава расстояние уровней $3d^6$ от вершины валентной зоны (Γ_8) равняется величине запрещенной зоны $\epsilon_g=0.514$ эВ. Пользуясь литературными данными для энергетического расстояния между уровнями

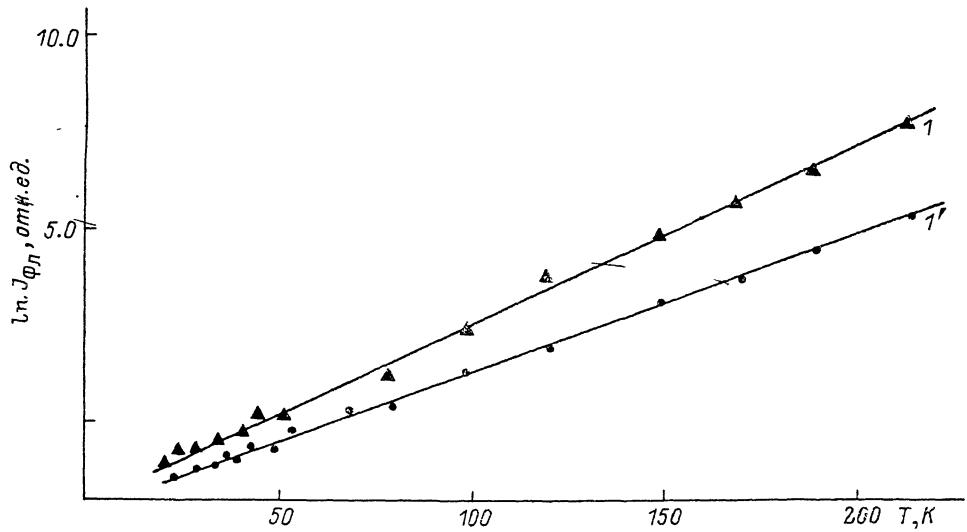


Рис. 6. Температурная зависимость интегральной фотолюминесценции для $Hg_{0.81}Mn_{0.19}Te$ (переход 1') и для $Hg_{0.77}Mn_{0.23}Te$ (переход I).

$3d^5$ и $3d^6$ для случая $Cd_{1-x}Mn_xTe$ [7], можно оценить глубину залегания уровня $3d^5$ в валентной зоне, которая в нашем случае оказывается ~ 4.9 эВ.

Наше предположение об участии локального уровня Mn^+ в фотолюминесценции согласуется с литературными данными для широкозонного полумагнитного полупроводника $Cd_{1-x}Mn_xTe$ [9].

Таким образом, в полумагнитных сплавах $Hg_{1-x}Mn_xTe$ с большим содержанием марганца ($x > 0.224$) в излучательную рекомбинацию вносят вклад оптические переходы с участием антисвязывающих состояний Mn^+ в запрещенной зоне на уровне мелкого акцептора, приписываемого обычно собственным дефектам.

Список литературы

- [1] Furdyna J. K. // J. Appl. Phys. 1988. V. 64. N 4. P. R29—R64.
- [2] Galazka R. R., Gelmont B. L., Ivanov-Omskii V. I., Postolaki I. T., Smirnov V. A. // Sol. St. Commun. 1986. V. 58. P. 311—314.
- [3] Wrobel J. M., Bassett L. C., Aubel J. L., Sundaram S. // J. Appl. Phys. 1986. V. 60. N 3. P. 1135—1138.
- [4] Баженов Н. Л., Гельмонт Б. Л., Иванов-Омский В. И., Ижин А. И., Смирнов В. А. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 1. С. 93—97.
- [5] Piotrowski T., Tomm J. W., Puhlman N. // Phys. St. Sol. (a). 1990. V. 117. N 1. P. K181—K183.
- [6] Васильев А. Э., Ильин Н. П., Мастеров В. Ф. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 7. С. 1253—1258.
- [7] Lee Y. R., Ramadas A. K., Aggarwal R. L. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 15. P. 10600—10610.
- [8] Larson B. A., Hass K. C., Ehrenreich H., Carlsson A. E. // Sol. St. Commun. 1985. V. 56. N 1. P. 347—352.
- [9] Агекян В. Ф., Фан Зунг // ФТТ. 1985. Т. 27. В. 4. С. 1216—1219.

Физико-технический
институт им. А. Ф. Иоффе
АН СССР
Ленинград

Получена 23.07.1990
Принята к печати 17.08.1990